Issue Classification

|--|--|

Α	p	p	li	C	a	ti	0	n	ı	С	0	n	t	rc)	l	١	ŀ	C

10595991

SMITH ET AL.

Applicant(s)/Patent Under Reexamination

Examiner

Art Unit

Leung, Quyen P

2874

		ORIG	SINAL							INTERNATIO	NAL	CL	ASS	IFIC	OITA	N
	CLASS			SUBCLASS	3				С	LAIMED				1	ION-CL	AIMED
385						2	В	6 / 10 (2006.0	01.01)							
	CF	(S)		G	0	2	В	6 / 34 (2006.0	01.01)			_				
CLASS	SUE	BCLASS (O	NE SUBCLAS	SS PER BLO	OCK)	 								-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
385	37															
	<u> </u>															
	 	<u> </u>		<u> </u>	 	_						 	ļ		-	
					-	\vdash			_					<u> </u>	\vdash	
	 							-					-			

					-	_										
		-														
					-									_		
			- 										-			
			-			\vdash							 	-		
						H										
																-
	.		-		<u> </u>		_									
							7 4									
							2 1 2					V				
													-	_		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												_	+	
											_ 1					
											_					
					-		\dashv									 -
							\dashv									
NONE (Assistant Examiner) (Date)					Duymkens						Total Claims Allowed:					lowed:
(Legal Instr Examiner)	hard	Leung, C	Quyen P Examiner)		\	ナ		0/25/07 ate)						O.G. Print Figure		